

맞춤형 Ptfе 실험실 주걱 부식 방지 식품 등급 무공해 재질 스폰 라운드 헤드

품목 번호: PL-CP254



소개

맞춤 제작 가능한 PTFE 실험실 주걱 및 재질 스폰은 비할 데 없는 내화학성과 식품 등급의 순도를 제공합니다. 미량 분석 및 가혹한 환경용으로 설계된 이 오염 방지 도구는 다양한 산업 및 실험실 응용 분야에서 낮은 배경 수치 결과와 우수한 내구성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
미량 원소 분석	질량 분석 및 원자 흡수 분광법 실험실에서 고순도 시료 처리.	금속 이온 오염을 방지하고 정확한 분석 결과를 보장합니다.
제약 배합	의약품 제제 중 활성 약물 성분(API) 및 부형제 측정 및 이동.	FDA 규정 준수 재질은 약물과의 교차 오염이나 화학적 상호 작용을 방지합니다.
반도체 공정	웨이퍼 제조를 위한 식각 화학물질 및 고순도 전구체 처리에 사용됨.	고순도 PTFE는 민감한 환경에서 입자 발생 및 화학적 용출을 방지합니다.
부식성 화학물질 샘플링	황산, 질산 또는 불산이 포함된 대형 용기에서 시료 채취.	산에 대한 완전한 저항성은 도구 열화를 방지하고 작업자 안전을 유지합니다.
식품 및 음료 품질 관리	실험실 또는 생산 라인 설정에서 산성 또는 기름진 식품 제품 샘플링.	다공성이 아닌 표면은 박테리아 성장을 방지하며 식품 안전을 위해 쉽게 멸균할 수 있습니다.
배터리 연구 및 생산	리튬 이온 배터리 개발에서 전해질 및 양극/음극 재질 처리.	공격적인 유기 탄산염 및 리튬 염에 대한 화학적 저항성.
극저온 재질 취급	액체 질소 또는 기타 초저온 환경에 보관된 샘플 이동.	-200°C에서 연성과 기능을 유지하며 취성이 되거나 균열이 생기지 않습니다.
중합체 합성	고온 수지 또는 특수 플라스틱의 중합 반응 중 교반 및 샘플링.	높은 내열성으로 인해 260°C까지 가열된 반응 혼합물과 직접 접촉이 가능합니다.

매개변수 그룹	사양 세부 정보	PL-CP254 호환성
모델 식별자	제품 품목 번호	PL-CP254
재질 구성	100% 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)	표준 표준
맞춤화 범위	완전히 맞춤화 가능한 치수, 손잡이 길이 및 헤드 모양	예 (주문 제작)
치수 (길이)	고객 요구 사항에 따라 가변 (100mm ~ 1000mm 이상)	맞춤화 가능
스폰 용량	응용 분야에 맞춤화 (마이크로 주걱부터 대형 산업용 스폰까지)	맞춤화 가능
온도 저항성	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)	표준 표준
내화학성	보편적 (pH 0-14), 용융 알칼리 금속 및 불소 가스 제외	표준 표준
표면 마감	높은 평활도의 기계 가공 마감 (낮은 Ra 값)	표준 표준
규정 준수 표준	FDA 승인, USP Class VI 재질 옵션 가능	표준 표준
세척 방법	오토클레이브, 초음파, 화학 용제 또는 에틸렌 옥사이드	표준 표준
흡수율	<0.01% (ASTM D570)	표준 표준
인장 강도	20-35 MPa (특정 등급에 따라 다름)	표준 표준

매개변수 그룹	사양 세부 정보	PL-CP254 호환성
밀도	2.14 ~ 2.19 g/cm ³	표준 표준